

2016年2月吉日

各位

公益社団法人 日本表面科学会 関東支部  
支部長 長谷川哲也

日本表面科学会 関東支部 主催「実用顕微評価技術セミナー2016」  
発表・展示のご協力お願い

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は日本表面科学会の活動にご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて当学会では、ナノ材料・デバイスの評価技術として重要な電子顕微鏡・走査プローブ顕微鏡を軸に、関連する新しい顕微評価技術の展開と促進を図り、産業界への貢献に努めたいと考えております。これまで装置メーカーや分析会社のご協力による最新の評価技術の紹介と、ユーザーからの意見や要望を提示していただく場を提供するため、表記の実用顕微評価技術セミナーを2013年より3回にわたって東京で開催いたしました。いずれもお蔭様で約20社の出展ご協力のもと毎回150名近くのご来場者の中で活発な情報交換がなされました。そこで今後もこれら顕微評価技術のさらなる普及と新たなニーズの掘り起こしのため当学会としても本セミナー開催を継続したく、来年度も下記のとおり各位のご協力を得てポスター展示を中心とした企画を実施することにいたしました。どうか本セミナーの開催に対するご理解と運営へのご支援を賜りたく、発表展示への参加申し込みにご協力をお願い申し上げます。

敬具

記

1. 開催要項

- (1) 開催日時 2016年 6月 17日 (金)
- (2) 場所 東京大学 小柴ホール (東大本郷キャンパス・理学部1号館内)
- (3) 時間 10:00～17:30 (予定)
- (4) 聴講者参加費 無料
- (5) 企画運営 日本表面科学会 関東支部会
- (6) 共催 日本表面科学会 産業連携委員会・企画委員会

2. 発表・展示要領

(1) 発表・展示時間

- ・ショートプレゼンテーション：10分/件
- ・ポスター展示説明：午前は昼食休憩を含めた約1.5時間と、午後はショートプレゼンテーション後の計2回（2.5時間程度）を予定しています。

\*上記時間は、発表件数により多少の変更が生じる場合があります。

(ご参考までに、次頁に前回セミナーのプログラムを示します。)

\*あくまで学会主催のセミナーですので、製品紹介のみのプレゼンテーション（セールストーク）とならないようご配慮下さい。

\*ポスター展示会場には、ボード1枚と机1つを準備致します。

(2) 発表・展示参加費

- A. ショートプレゼンテーション・ポスター展示、広告  
維持会員・賛助会員：40,000円、一般企業：50,000円
- B. 広告のみ

維持会員・賛助会員：30,000円、一般企業：40,000円

\*テキストに掲載する発表用資料、および広告の原稿を予めご提出頂きます。

テキストに掲載できる発表用スライドは12枚まで（“2 in 1”形式で6ページ以内）、  
 広告(A4サイズ)は4ページ以内の計10ページ以内(広告のみの場合は4ページ以内)、  
 いずれもモノクロ印刷とします。

### (3) 申し込み方法

- ・ポスター展示等にご協力頂ける場合は、添付の申し込み用紙に必要事項をご記入の上、e-mailにファイルを添付してお申し込み下さい。
- ・発表用資料原稿はPPTファイル形式で、広告原稿はPDFなどの電子ファイルにて提出下さい。

\*申し込み・原稿提出先：

日本表面科学会産業連携委員会委員 多持 隆一郎 (株)日立ハイテクノロジーズ

E-mail: ryuichiro.tamochi.jg@hitachi-hihgtech.com

\*申し込み締め切り 2016年 3月18日 (金)

\*原稿提出締め切り 2016年 5月16日 (月)

### 3. その他

セミナー終了後に、発表・展示各社の交流を目的に簡単な交流会（無料）を開催することを計画しています。

(ご参考) 前回セミナー[実用顕微評価技術セミナー2015]プログラム

時間	会社名	発表タイトル	発表者 (敬称略)
10:00~11:30	日本電子(株)	極低エネルギー入射電子によるSEM観察	小倉 一道
	(株)日立ハイテクノロジーズ	姿勢制御技術を用いたFIB-SEMIによる高品位TEM試料作製	和田 博之
	(株)コベルコ科研	集束イオンビーム加工観察装置(FIB-SEM)を用いた大気非開放3D構造解析	高田 一
	(株)日産アーク	Cryo-SEM法および3D-SEM法を用いた燃料電池触媒層の解析事例紹介	島貫 純一
	アメテック(株)	高分解能イオン顕微鏡(NanoSIMS 50L)による高感度元素マッピング	石川 真起志
	アルバック・ファイ(株)	PHI nanoTOF II TOF-SIMSによる顕微分析	眞田 則明
	東芝ナノアナリス(株)	3次元アトムプローブによるNi/Si/Si接合の低抵抗化の解析	間山 憲仁
11:30~13:00	ポスターセッション・展示／昼食		
13:00~13:50	特別講演「収差補正STEMによる界面・表面の原子構造解析」 幾原 雄一先生(東京大学大学院工学系研究科)		
13:50~16:00	オックスフォード・インストゥルメンツ(株)	アサイラム リサーチAFMの新しい表面・界面観察技術	出口 匡
	(株)テックサイエンス	コンパクト型SPM [NaioAFM/STM] のご紹介	小野寺 毅師
	(株)島津製作所	FM-AFMの高分子材料への応用とAM-AFMとの比較	粉川 良平
	(株)ユニソク	最新の低温SPM技術のご紹介	小澤 太健展
	物質・材料研究機構	ナノプローブ顕微鏡によるナノ計測とナノ加工	藤田 大介
	日本カンタム・デザイン(株)	表面形状をリアルタイムで3D観察・解析できる 「デジタル・ホログラフィック顕微鏡」の紹介	山田 昌弘
	日本カンタム・デザイン(株)	10nmに迫る分解能でイメージング&赤外分光測定を可能にする 「nano-FIR測定装置」の紹介	山田 昌弘
	WITec (株)	共焦点ラマン顕微鏡の高分解能化、高S/N化の最前線 ～ラマン分光と他分析装置との融合	中本 圭一
	レニショー(株)	ラマンイメージングとSPM/AFM-ラマン	三澤 真弓
	(株)日本サーマル・コンサルティング	AFM-IRスペクトロスコープによるポリマーコンポジットの境界状態評価	浦山 憲雄
オミクロン ナノテクノロジー ジャパン(株)	有機フィルム表面の定量的強度測定	大川 登志郎	
16:00~17:00	ポスターセッション・展示		

## 実用顕微評価技術セミナー2016 参加申し込み

(このページのみ、e-mailに添付して下さい。)

### 申込み者:

氏名(ふりがな)	
会社名	
所属	
住所	
TEL	
E-mail	
参加区分(参加費)	ショートプレゼンテーション・ポスター展示・広告に参加 <input type="checkbox"/> 維持会員・賛助会員(40,000円) <input type="checkbox"/> 一般(50,000円)
該当の□を■にして下さい	広告のみに参加 <input type="checkbox"/> 維持会員・賛助会員(30,000円) <input type="checkbox"/> 一般(40,000円)

### 発表(ショートプレゼンテーション・ポスター)タイトル:

--

### 発表者:(申込み者と同じ場合は記入不要)

氏名(ふりがな)	
会社名	
所属	
住所	
TEL	
E-mail	

### ご意見など:

--

以上